

名称	走査型電子顕微鏡
分類	分析機器類
メーカー	(株) 日立ハイテクノロジーズ
型式	S-3700N
仕様及び性能	分解能 高真空 3.0 nm、低真空 4.0 nm 分析可能元素 B～U 倍率 ×15～×300000 加速電圧 0.3 kV～30 kV 低真空度設定 6 Pa～270 Pa 最大試料寸法 300 mm径 最大観察可能範囲 203 mm径
用途	素材や部品の形状観察及び表面状態の観察、元素分析を行う装置です。 (絶縁物試料を直接観察・分析、試料の組成情報と微細形状の比較観察など)
導入年	2019年7月
料金	4,460 円/時間
設置場所	福島RTF研究棟：機器分析室 1
予約・連絡先	0244-25-3060 (ハイテクプラザ南相馬技術支援センター)
備考	※ご利用申込前にハイテクプラザ南相馬技術支援センターと打合せを行ってください。 ※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。